

- | | | |
|---------------------------|----------------|-------------|
| 1 長さ | 11 密度 | 21 測光量・放射量 |
| 2 幾何学量(全2頁) | 12 粘度・動粘度 | 22 放射線(全2頁) |
| 4 質量 | 13 体積 | 23 放射能 |
| 5 力 | 14 音響 | 24 中性子(全3頁) |
| 6 トルク | 15 超音波 | 25 温度 |
| 7 圧力(全2頁) | 17 衝撃加速度 | 26 湿度(全2頁) |
| 8 重力加速度 | 19 直流・低周波(全2頁) | 27 熱物性 |
| 9 真空 | 20 高周波 | 28 硬さ |
| 10 流量(全3頁) | | 30 粒子・粉体特性 |
| | | 31 純度 |
| | | 32 薄膜・多層膜 |
| | | 33 濃度 |
| | | 34 分子量 |
| 51 計量器の構成要素及び検査装置の試験(全4頁) | | |
| 52 その他 | | |
| 53 OIML適合性試験(全2頁) | | |

依頼試験手数料額は、校正手数料(消費税抜)と下記校正証明書手数料(消費税抜)を加えた額に消費税額を加えた金額になります。

校正証明書手数料(消費税抜)

和文	1部につき	1,500円
英文	1部につき	2,700円

証明書の発送はご入金後となります。

手数料は、当所の都合で校正・試験が完了しなかった場合以外、お返しできません。 当所の都合により完了しなかった場合には、全額返却致します。

別表 2－1 計量の標準に係る校正、試験等

2026. 7. 15

●依頼試験手数料の額（消費税等抜き）は、別表 2-1 内手数料の額に校正証明書手数料の額を加えた額になります。

校正証明書手数料						
校正証明書手数料						
和文 1 部につき 1,500 円 （正本・複本とも同じ）						
英文 1 部につき 2,700 円 （正本・複本とも同じ）						
No.	種類	項目	細目	手数料（基本料金）（円）		備考
1	長さ	ブロックゲージ絶対測定	短尺(呼び寸法が100 mm以下のもの)	1個につき	37,500	
			中尺(呼び寸法が100 mmを超え250 mm以下のもの)	1個につき	55,400	
			長尺（呼び寸法が250 mmを超え1 000 mm以下のもの）	1個につき	108,800	
			短尺（密着済みブロックゲージ、呼び寸法が100 mm 以下のもの）	1個につき	37,000	
		低熱膨張係数ブロックゲージ絶対測定	短尺(呼び寸法が100 mm以下のもの)	1個につき	37,500	熱膨張係数は±0.5×10 ⁻⁶ 以下
			中尺(呼び寸法が100 mmを超え250 mm以下のもの)	1個につき	55,400	熱膨張係数は±0.5×10 ⁻⁶ 以下
			長尺（呼び寸法が250 mmを超え1 000 mm以下のもの）	1個につき	108,800	熱膨張係数は±0.5×10 ⁻⁶ 以下
			短尺（密着済みブロックゲージ、呼び寸法が100 mm 以下のもの）	1個につき	37,000	熱膨張係数は±0.5×10 ⁻⁶ 以下
		段差高さ	ブロックゲージ対（それぞれのブロックゲージの呼び寸法は 0.5 mm以上 100 mm以下、呼び寸法の差は -10 μm以上 10 μm以下の範囲）	1対につき	69,900	基本の1対のうちの1本を基準として、ブロックゲージが 1 本増す毎に32,900円を加算する。 呼び寸法が30 mm未満の場合8本まで、30 mm以上50 mm未満の場合4本まで、50 mm以上の場合1本のみ追加可能。
			段差高さゲージ	1個4段差まで	81,800	1段差を追加する毎に3,600円を加算する。
		標準尺絶対測定(指定線間)	普通精度(精度が2 μm又はそれより低いもの)	1個につき	239,400	
			高精度（精度が0.5 μm又はそれより低いもの）	1個につき	394,000	
		距離計	光波距離計（校正範囲5 m以上200 m以下）	距離計本体・反射鏡1組につき	331,300	反射鏡を1個追加する毎に116,400円を加算する。
		干渉測長器	校正範囲93 m以下	1個10箇所まで	191,100	
		固体屈折率	BK7又は同等品（真空中波長632.99 nmにおいて屈折率が1.51以上1.52以下）	1個3測定箇所につき	254,900	1測定箇所を追加する毎に48,900円を加算する。
			BK7又は同等品(真空中波長546.2 nmにおいて屈折率が1.51以上1.53以下)	1個3測定箇所につき	268,800	1測定箇所を追加する毎に81,500円を加算する。
2	幾何学量	触針式段差・深さ		1個につき	318,100	
		ボールプレート・ホールプレート	レーザ干渉測定 560 mm以下	1個につき	447,700	
			参照標準との比較測定 700 mm以下	1個につき	243,600	

		ステップゲージ	1 020 mm以下	1個につき	388, 100	
		ボールバー	レーザ干渉測定 720 mm以下	1個につき	374, 600	
			参照標準との比較測定 1 020 mm以下	1個につき	121, 200	
		一次元グレーティング	23 nm以上8 μ m以下	1個につき	515, 000	
		二次元グレーティング	100 nm以上8 μ m以下	1個につき	1, 063, 600	
		二次元グリッド	マーク中心座標 350 mm ×350 mm まで	1個100測定箇所につき	430, 600	1測定箇所を追加する毎に3, 100円を追加する。
		線幅(パターン寸法)	10 nm 以上0. 5 μ m 以下	1個につき	717, 000	試料外形 105 mm × 105 mm × 10 mm 以下
		オートコリメータ	最大校正範囲±5° 校正点数約200 点	1個1軸	215, 900	2軸目を校正する場合は、153, 900円を加算する。
		線幅フォトマスク	0. 5 μ m以上 10 μ m以下	1個につき	391, 900	1校正線を追加する毎に175, 200円を加算する。
		CTによる幾何形状測定	10 mm以上200 mm以下	1項目につき		形状等により別途見積
		CMMによる幾何形状測定		1項目につき		形状等により別途見積
		ロータリーエンコーダ		1個につき	266, 000	
		多面鏡	6面以下	1個につき	173, 000	
			7面以上24面以下	1個につき	189, 500	
			25面以上48面以下	1個につき	255, 400	
		表面粗さ測定	粗さ用標準片	1 個につき	333, 000	
		平面度	口径300 mm以下	1個1面につき	195, 900	
		真直度	50 mm 以上1 050 mm 以下	1個1ラインにつき	370, 300	1ラインを追加する毎に70, 700円を加算する。
		球面度	基準球面との比較測定（基準球面形状の補正なし）	1個につき	186, 100	
			基準球面との比較測定（基準球面形状の補正あり）	1個につき	371, 100	
		AFM方式段差測定		1個につき	865, 500	
		AFM式表面粗さ測定	算術平均粗さRa ： 0. 2 nm 以上100 nm 以下	1個につき	462, 400	試料外形 20 mm × 20 mm × 4 mm 以下
		真円度	真円度用球又は半球 直径の呼び寸法：5 mm 以上100 mm 以下 校正範囲：0 μm 以上1 μm 以下	1個につき	514, 400	
		歯形	基礎円直径： 25 mm 以上200 mm 以下	1個につき（1測定ライン含む）	341, 400	1測定ラインを追加する毎に11, 200円を加算する。
		歯すじ	基準円直径： 25 mm 以上200 mm 以下	1個につき（1測定ライン含む）	341, 400	1測定ラインを追加する毎に11, 200円を加算する。
		歯車ピッチ	基準円直径： 60 mm 以上300 mm 以下	1個につき	328, 600	

4	質量	分銅又はおもり	校正範囲が100 μg以上1 mg未満のもの		1個につき	178,500	
			校正範囲が1 mg以上100 g未満のもの		1試料につき	70,000	比較測定については70,000円を加算する。
			校正範囲が100 g以上20 kg以下のもの		1試料につき	106,300	比較測定については106,300円を加算する。
			校正範囲が20 kgを超え1 050 kg以下のもの	相対拡張不確かさが15 ppm以下	1試料につき	175,000	質量調整のある場合は175,000円を加算する。
				相対拡張不確かさが15 ppmを超えるもの	1試料につき	87,700	質量調整のある場合は87,700円を加算する。
			校正範囲が1 050 kgを超え5 200 kg以下のもの		1個につき	333,400	質量調整のある場合は333,400円を加算する。
		特性試験	分銅の体積・磁化率及び表面粗さ		1個につき	65,200	
5	力	高精度力計	最小荷重が 1 N未満のもの		1個につき	320,400	最大荷重は 2 Nまでとする。 1試験項目を追加する毎に320,400円を加算する。
			最小荷重が 1 N以上かつ、最大荷重が 1 MN以下のもの		1個につき	223,900	1試験項目を追加する毎に223,900円を加算する。
			最大荷重が 1 MNを超えるもの		1個につき	536,200	1試験項目を追加する毎に基本料金の536,200円を加算する。
6	トルク	トルクメータ	校正範囲が 0.01 N・m以上、10 N・m以下のもの		1台8ステップ内、片側ねじりにつき	157,000	左右ねじりの場合、119,000円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に19,000円を加算する（但し最大10ステップ）。
			校正範囲が 2 N・m以上、1 kN・m以下のもの		1台8ステップ内、片側ねじりにつき	177,700	左右ねじりの場合、157,300円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に20,400円を加算する（但し最大10ステップ）。
			校正範囲が 200 N・m以上、20 kN・m以下のもの		1台8ステップ内、片側ねじりにつき	239,800	左右ねじりの場合、189,700円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に25,000円を加算する（但し最大10ステップ）。
		参照用トルクレンチ	校正範囲が 0.1 N・m以上、10 N・m以下のもの		1台8ステップ内、片側ねじりにつき	157,000	左右ねじりの場合、119,000円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に19,000円を加算する（但し最大10ステップ）。
			校正範囲が 2 N・m以上、1 kN・m以下のもの		1台8ステップ内、片側ねじりにつき	177,700	左右ねじりの場合、157,300円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に20,400円を加算する（但し最大10ステップ）。
			校正範囲が 200 N・m以上、5 kN・m以下のもの		1台8ステップ内、片側ねじりにつき	239,800	左右ねじりの場合、189,700円を加算する。 校正ステップを1ステップ増す毎に 25,000円を加算する（但し最大10ステップ）。
7	圧力	気体	ゲージ圧力 5 kPa以上100 MPa以下		1台につき (校正圧力点5点以下)	252,000	校正圧力点が6点以上の場合は1点につき50,400円を加算する。
			絶対圧力 5 kPa以上7 MPa以下		1台につき (校正圧力点5点以下)	383,900	校正圧力点が6点以上の場合は1点につき76,700円を加算する。 真空排気による絶対圧力校正。
			絶対圧力110 kPa以上100 MPa以下		1台につき (校正圧力点5点以下)	252,000	校正圧力点が6点以上の場合は1点につき50,400円を加算する。 大気圧計を使用した絶対圧力校正。
			差圧1 Pa以上10 kPa以下（ライン圧力100 kPa±10 kPa）		1台につき (校正圧力点4点以下)	427,200	校正圧力点が5点以上の場合は1点につき85,400円を加算する。
			絶対圧力1 Pa以上10 kPa以下		1台につき (校正圧力点4点以下)	427,200	校正圧力点が5点以上の場合は1点につき85,400円を加算する。

		液体	1 MPa以上500 MPa以下	1台につき (校正圧力点 5点以下)	251,500	校正圧力点が6点以上の場合は1点につき 50,200円を加算する。
			100 MP a 以上1 GPa以下	1台につき (校正圧力点 5点以下)	299,100	校正圧力点が6点以上の場合は1点につき 59,800円を加算する。
8	重力加速度	絶対重力計		1台につき	851,800	
9	真空	真空計	スピニングロータ真空計 (0.1 mPa以上10 Pa以下のもの)	1個1校正点に つき	328,400	校正圧力点が3点以上の場合は1点につき 164,400円を加算する。
			隔膜真空計(0.1 Pa以上2 000 Pa以下のもの)	1個3校正点に つき	291,000	校正圧力点が3点以上の場合は3点につき、 23,700円を追加する。
			電離真空計1×10 ⁻⁶ Pa以上1×10 ⁻⁴ Pa以下	1個につき	333,000	
			電離真空計1×10 ⁻⁹ Pa 以上 2×10 ⁻⁶ Pa以下	1個につき	439,800	校正ガスを窒素とする。金属ガスケットで 真空装置に接続できる真空計に限る。
			分圧真空計1×10 ⁻⁶ Pa以上1×10 ⁻⁴ Pa以下 (N ₂ , Ar, He, H ₂)	1個1ガスにつ き	369,800	追加ガスを1種追加する毎に113,600円を加 算する。
		リーク	標準リーク1×10 ⁻¹⁰ Pa m ³ /s以上1×10 ⁻⁶ Pa m ³ /s以下	1個につき	304,600	真空へのリーク量 (ヘリウム)
			標準リーク 5×10 ⁻⁷ Pa m ³ /s以上1×10 ⁻⁴ Pa m ³ /s以下	1個1ガスにつ き	267,000	真空へのリーク量 (ヘリウム、アルゴン) 校正点1点追加につき、63,400円を加算す る。
			標準リーク 5×10 ⁻⁷ Pa m ³ /s以上1×10 ⁻⁴ Pa m ³ /s以下	1個につき	170,600	大気中へのリーク量 (窒素) 校正点1点追加につき、37,500円を加算す る。
			標準リーク 5×10 ⁻⁷ Pa m ³ /s以上1×10 ⁻⁴ Pa m ³ /s以下	1個1ガスにつ き	232,700	大気中へのリーク量 (ヘリウム、R134a、 水素5 %+窒素95 %混合ガス、アルゴン) 校正点1点追加につき、57,700円を加算す る。
		標準コンダクタンス	標準コンダクタンスエレメント N ₂ に対して、1×10 ⁻¹¹ m ³ /s以上1×10 ⁻⁸ m ³ /s以下 (追加ガスとして、 Ar, He, H ₂)	1個1ガスにつ き	94,800	一次圧力を10 ² Pa以上10 ⁵ Pa以下で、コン ダクタンスの圧力依存性が3 %以下である 圧力範囲で測定する。真空対応の接続配管 を有し、ガス放出の小さいもの (二次圧力 の到達圧力10 ⁻⁶ Pa以下)。追加ガスを1種 追加する毎に、77,300円を加算する。
10	流量	気体小流量	音速ノズル (衡量法) (口径0.05 mm以上2.5 mm以下のもの)	1個気体1種類 につき	895,200	
			音速ノズル (比較法) (口径0.05 mm以上2.5 mm以下のもの)	1個気体1種類 につき	528,300	
			気体小流量用流量計 (比較法)	1台気体1種類 につき	528,300	
			気体小流量用流量計 (PVT t 法)	1台気体1種類 につき	540,600	
		気体中流量	気体用流量計 (閉ループ法)	1個1圧力5流 量につき	273,500	1圧力を追加する毎に247,800円を加算す る。 同一圧力で5流量を超える場合は1流量毎に 27,400円を加算する。
		気体中流速	超音波流速計等 (1.3 m/s以上40 m/s以下)	1個10流速に つき	331,400	1流速を追加する毎に66,200円を加算す る。
			レーザ流速計 (1.3 m/s 以上40 m/s 以下)	1個につき	388,100	

気体大流速	ピトー管（40 m/s 以上90 m/s 以下）	1個6流速につ き	369,000	ピトー管の取り付け及び取り外し、並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。 6流速を超え1流速増す毎に、38,800円を加算する。
液体小流量	水用流量計（口径25 mm以下）	1個5流量につ き	348,000	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。 研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。 5流量を超え1流量を追加する毎に44,800円を加算する。
液体大流量及び中流量	水用流量計（口径15 mm以上50 mm未満）	1個5流量につ き	449,100	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。 研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。 5流量を超え1流量を追加する毎に49,300円を加算する。
	水用流量計(口径50 mm以上175 mm以下)	1個5流量につ き	553,000	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。 研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。5流量を超え1流量を追加する毎に66,400円を加算する。
	水用流量計（口径175 mmを超え400 mm以下）	1個5流量につ き	828,700	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。 研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。 5流量を超え1流量を追加する毎に92,400円を加算する。
	水用流量計（口径400 mmを超え600 mm以下）	1個5流量1温 度につき	4,503,900	流量計の取り付け及び取り外し並びに特殊な形状の配管等に必要な費用は含まない。 研究所が取り付け及び取り外しを行う場合は、別途見積もる金額を加算する。 5流量を超え1流量を追加する毎に229,200円を加算する。 1校正温度点を追加する毎に1,006,500円を加算する。
石油小流量（軽油・灯油・工業ガソリン）	範囲：0.02 L/h 以上 100 L/h 以下 4.4×10 ⁻⁶ kg/s 以上 2.2×10 ⁻² kg/s 以下	1個3流量につ き	341,800	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形状の配管等を使用する場合に必要な費用は含まない。 1流量を追加する毎に53,400円を加算する。 1校正温度を追加する毎に69,400円を加算する。 1校正試験液を追加する毎に98,800円を加算する。
石油中流量（軽油・灯油・低粘度工業用潤滑油（スピンドル油））・工業ガソリン	範囲：0.1 m ³ /h以上15 m ³ /h以下、0.022 kg/s以上3.4 kg/s以下	1個3流量につ き	319,600	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形状の配管等を使用する場合に必要な費用は含まない。 1流量を追加する毎に39,700円を加算する。 1校正温度を追加する毎に83,100円を加算する。 1校正試験液を追加する毎に169,900円を加算する。

		石油大流量（軽油・灯油）	範囲：3 m³/h以上300 m³/h以下、0.67 kg/s以上67 kg/s以下		1個3流量につき	1,648,000	校正器物の形状が特殊な場合又は特殊な形状の配管等を使用する場合に必要な費用は含まない。 1流量を追加する毎に413,800円を加算する。 1校正温度を追加する毎に205,700円を加算する。 1校正試験液を追加する毎に413,800円を加算する。
11	密度	シリコン単結晶	圧力浮遊法による密度差校正 密度差：0 kg/m³以上0.035 kg/m³以下 質量：5 g以上1 010 g以下		1個につき	269,900	
		固体材料	液中ひょう量法による固体密度測定 密度：800 kg/m³以上20 000 kg/m³以下 質量：30 g以上1 010 g以下		1個につき	288,000	
		密度標準液	水溶液 温度20 ℃，密度998 kg/m³～1 050 kg/m³		1試料につき	183,800	
12	粘度・動粘度	粘度標準液	動粘度	-40 ℃ ～ 100 ℃ (20 ℃ ～ 40 ℃を除く)	使用細管粘度計1種類1指定温度につき	116,500	使用細管粘度計が同一の場合において、1指定温度を追加する毎に39,500円を加算する。
			粘度	-40 ℃ ～ 100 ℃ (20 ℃ ～ 40 ℃を除く)	使用細管粘度計1種類1指定温度につき	174,300	使用細管粘度計が同一の場合において、1指定温度を追加する毎に63,600円を加算する。
13	体積	タンク（衡量法）	容量10 L		1個1目盛につき	119,000	校正する目盛を1カ所追加する毎に59,500円を加算する。
			容量20 L以上100 L以下		1個1目盛につき	177,600	校正する目盛を1カ所追加する毎に88,800円を加算する。
			容量100 Lを超え200 L以下		1個1目盛につき	248,900	校正する目盛を1カ所追加する毎に124,400円を加算する。
		タンク（衡量法及び比較法）	容量10 L		1個1目盛につき	119,000	予備ゲージ1本（1目盛の校正を含む）を追加する毎に59,700円を加算する。 ガラス製体積計を用いて校正する目盛を追加する場合は、1カ所追加する毎に14,400円を加算する。
			容量20 L以上100 L以下		1個1目盛につき	177,600	予備ゲージ1本（1目盛の校正を含む）を追加する毎に89,400円を加算する。 ガラス製体積計を用いて校正する目盛を追加する場合は、1カ所追加する毎に14,400円を加算する。
			容量100 Lを超え200 L以下		1個1目盛につき	248,900	予備ゲージ1本（1目盛の校正を含む）を追加する毎に125,400円を加算する。 ガラス製体積計を用いて校正する目盛を追加する場合は、1カ所追加する毎に14,400円を加算する。

14	音響	音場感度（計測用マイクロホン）	I 形20 Hz以上12.5 kHz以下、Ⅱ形20 Hz以上20 kHz以下、WS3形20 Hz以上20 kHz 以下	1個1校正周波数につき	86,000	1校正周波数を追加する毎に2,600円を加算する。
			WS3形 20 kHz以上100 kHz以下	1個1校正周波数につき	124,700	1校正周波数を追加する毎に21,000円を加算する。
		音圧感度（計測用マイクロホン）	I 形(1 Hz以上20 Hz以下)	1個1校正周波数につき	152,300	1校正周波数を追加する毎に12,900円を加算する。
		音響パワーレベル(基準音源)	50 Hz 以上20 kHz 以下 (1/3 octave band)	1個につき	354,000	基準音源の電源周波数として50 Hz もしくは60 Hz のうち1つを指定。
			100 Hz 以上10 kHz 以下 (1/3 octave band)	1 個につき	311,700	基準音源の電源周波数として50 Hz もしくは60 Hz のうち1つを指定。
15	超音波	音場感度（ハイドロホン）	100 kHz以上1 MHz以下(周波数間隔50 kHz、19点校正)	1個19周波数につき	265,800	
			0.5 MHz以上20 MHz以下	1個1周波数につき	158,800	1周波数を追加する毎に700円を加算する。 (参考例) 1 MHz毎に1 MHzから20 MHzまで校正する場合の料金は172,100円（20校正点） 0.1 MHz毎に0.5 MHzから20 MHzまで校正する場合の料金は295,300円（196校正点）
			21 MHz 以上40 MHz 以下（周波数間隔1 MHz、20周波数以内）	1個20周波数以内につき	175,000	メンプレン型ハイドロホン（受波部直径公称値0.5 mm 以下）
			41 MHz以上60 MHz以下（周波数間隔1 MHz、20周波数以内）	1個20周波数以内につき	199,900	メンプレン型ハイドロホン（受波部直径公称値0.5 mm以下）
		超音波パワー	1 mW以上15 W以下（0.5 MHz以上15 MHz以下） 1 mW以上500 mW以下（15 MHz以上20 MHz以下）	1個1周波数又は1パワーにつき	86,800	1周波数又は1パワーを追加する毎に53,000円を加算する。
			15 W以上200 W以下（1 MHz以上3 MHz以下）	1個1周波数又は1パワーにつき	251,300	1周波数又は1パワーを追加する毎に37,000円を加算する。
17	衝撃加速度	電圧感度	ピーク加速度：50 m/s ² 以上10 000 m/s ² 以下	1個2校正点（1 000 m/s ² 、5 000 m/s ² ）につき	142,700	加速度センサの取付及び特殊な形状の治具制作等の費用は含まない。 2校正点を超え1校正点を追加する毎に42,900円を加算する。
		電荷感度	ピーク加速度：50 m/s ² 以上10 000 m/s ² 以下	1個2校正点（1 000 m/s ² 、5 000 m/s ² ）につき	204,800	加速度センサの取付及び特殊な形状の治具制作等の費用は含まない。 2校正点を超え1校正点を追加する毎に52,300円を加算する。
19	直流・低周波	変流器	試験変流器の同相誤差、直角相誤差が（1 %, 1 %）より小さいもの 試験周波数：45, 50, 55, 60, 120, 200, 400, 700, 1 000 Hz 試験変流比：1以上1 000以下 試験1次電流5 A以上100 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比レンジ1電流につき （試験変流比の各レンジにおける10試験点数まで）	579,000	他の試験と組み合わせる場合は1点を追加する毎に121,400円を加算する。 10試験点数を超える場合は1点を追加する毎に121,400円を加算する。
			試験変流器の同相誤差、直角相誤差が（1 %, 1 %）より小さいもの 試験周波数：2 000, 4 000 Hz 試験変流比：1以上1 000以下 試験1次電流5 A以上50 A以下	1個1周波数帯 1試験変流比レンジ1電流につき （試験変流比の各レンジにおける10試験点数まで）	579,000	他の試験と組み合わせる場合は1点を追加する毎に121,400円を加算する。 10試験点数を超える場合は1点を追加する毎に121,400円を加算する。

		蓄電池の内部インピーダンス測定器	1 Ω ～ 100 Ω / 1 kHz	1個19点につき	530,400	校正依頼品は、蓄電池の内部インピーダンス測定器であって、4端子対定義に基づく測定方式であること。計測器における直流電圧の設定は、0 Vに限定する。 基本校正点は、1 Ω～10 Ω（1 Ωきざみ）、及び、10 Ω～100 Ω（10 Ωきざみ）の計19点とする。 基本校正点以外のインピーダンス値を追加する毎に、28,500円を加算する。
20	高周波	光ファイバパワー応答度(光パワーメータ)	850 nm 帯、光ファイバパワー 50 μW ～ 1 mW	1台1波長点1 パワーレベル につき	124,400	1パワーレベルを追加する毎に53,600円を加算する。 波長は 840 nm 以上 860 nm以下の範囲で任意に選択可能。
			1 310 nm 帯、光ファイバパワー 50 μW ～ 1 mW	1台1波長点1 パワーレベル につき	144,000	1波長点1パワーレベルを追加する毎に20,700円を加算する。 波長は 1 260 nm 以上 1 360 nm 以下の範囲で任意に選択可能。
			1 550 nm 帯、光ファイバパワー 50 μW ～ 1 mW	1台1波長点1 パワーレベル につき	143,300	1波長点1パワーレベルを追加する毎に20,600円加算する。 波長は 1 520 nm 以上 1 630 nm 以下の範囲で任意に選択可能。
21	測光量・放射量	分光放射照度応答度	波長 360 nm 以上830 nm 以下5 nm毎	1個につき	212,300	オーバーフィル条件（A m ² /W）による測定
		分光全放射束 （4π放射光源用）	校正対象：ハロゲン電球（JD型、定格24 V,150 W） 波長：360 nm以上830 nm以下、5 nm間隔	電球1個につき	480,700	全光束の校正を含む。2～3個目は電球 1 個につき、131,800円を加算する。 ハロゲン電球は、十分な枯化、安定性確認、及び再現性確認の実績を有するもので、規定の口金アダプタを装着のこと。
22	放射線	照射線量（率）測定器	マンモグラフィX線（Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh,W/Rh, W/Ag, W/Al）	1台1校正点につき	167,200	1点を追加する毎に45,600円を加算する。
		放射線量検出素子	マンモグラフィX線（Mo/Mo, Mo/Rh, Rh/Rh,W/Rh, W/Ag, W/Al）	1回照射につき	144,100	1照射を追加する毎に26,800円を加算する。
		医療用リニアック放射線治療用固体線量計基準照射	高エネルギー光子線（4 MV, 6 MV, 10 MV, 15 MV, FFF 6 MV, FFF 10 MV）、高エネルギー電子線（9 MeV, 12 MeV, 15 MeV, 18 MeV）	1個1点につき	156,300	固体線量計を1個追加する毎に53,600円を加算する。
		β線	β線組織吸収線量率測定器 β線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	121,000	1点を追加する毎に19,200円を加算する。
			β線組織吸収線量測定器 β線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	130,800	1点を追加する毎に28,800円を加算する。
			β線組織吸収線量検出素子 β線標準場を生成する線源の種類Sr/Y-90線源、Kr-85線源、Pm-147線源	1個1点につき	109,200	1点を追加する毎に21,600円を加算する。
			β線水吸収線量率測定器 β線標準場を生成する線源の種類Ru-106	1個1点につき	139,200	1点を追加する毎に16,900円を加算する。
			β線水吸収線量測定器 β線標準場を生成する線源の種類Ru-106	1個1点につき	147,600	1点を追加する毎に25,400円を加算する。
			線量当量率測定器 β線を生成する線源の種類Sr/Y-90、校正対象物理量：3 mm線量当量率	1個1点につき	121,000	1点を追加する毎に19,200円を加算する。

			線量当量測定器 β 線を生成する線源の種類Sr/Y-90、校正対象物理量：3 mm線量当量	1個1点につき	130,800	1点を追加する毎に28,800円を加算する。
			線量当量検出素子 β 線を生成する線源の種類Sr/Y-90、校正対象物理量：3 mm線量当量	1個1点につき	109,200	1点を追加する毎に21,600円を加算する。
		基準空気カーマ率（ヨウ素125 密封小線源）	ヨウ素125 密封小線源	1個につき	132,200	1個追加する毎に81,200円を加算する。 WS 使用の場合
			密封小線源測定器	1個につき	146,600	1個追加する毎に95,600円を加算する。
		基準空気カーマ率（イリジウム192 密封小線源）	密封小線源測定器	1台1校正点につき	229,400	
	23	放射能濃度	4 π β - γ 測定装置による絶対測定校正試験 100 kBq/g 以上 2 MBq/g 以下のもの	1個1核種につき	79,600	
			電離箱又はGe半導体検出器による比較測定校正試験 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	28,500	
			T D C R 装置による絶対測定校正試験(H-3, C-14, Fe-55) 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	263,400	
			液体シンチレーションカウンタによる比較測定校正試験 20 Bq/g 以上 400 MBq/g以下のもの (核種は問い合わせのこと)	1個1核種につき	154,800	H-3標準溶液の供給がない場合、H-3での絶対測定校正試験と同時に行うことが必要
		放射能濃度（放射性ガス）	1 Bq・cm ⁻³ 以上2 kBq・cm ⁻³ 以下のもの	1個につき	1,155,000	放射能（濃度）を1点追加する毎に198,700円を加算する。
		放射能試料	粒子放出率・スペクトル試験2 kBq以上4 MBq以下のもの	1試料につき	55,900	
			γ (X) 線放出率の遠隔校正 範囲：2 ks ⁻¹ 以上4 Ms ⁻¹ 以下及び50 keV以上1.8 MeV以下のもの	1個1核種につき	48,400	1核種を追加する毎に3,600円を加算する。
				初回設定手数料	14,400	
		放射能（放射性ガス）	5 kBq 以上3 MBq 以下のもの	1個につき	1,155,000	放射能（濃度）を1点追加する毎に198,700円を加算する。
		放射能測定器	校正試験20 Bq/ g 以上400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	76,900	1核種を追加する毎に76,900円を加算する。
			γ 線核種用放射能測定用電離箱の遠隔校正 範囲：40 kBq/ g 以上400 MBq/g以下のもの	1個1核種につき	48,400	1核種を追加する毎に3,600円を加算する。
				初回設定手数料	14,400	
		放射性ガスモニタ	30 Bq・cm ⁻³ 以上100 Bq・cm ⁻³ 以下で担体ガスがPR ガス又はメタンガスであるもの	1個につき	1,183,500	放射能濃度を1点追加する毎に213,400円を加算する。
			30 Bq・cm ⁻³ 以上2 kBq・cm ⁻³ 以下で担体ガスが乾燥空気であるもの	1個につき	1,705,000	放射能濃度を1点追加する毎に173,900円を加算する。
		放射能面密度	Am-241コイン状線源0.3 Bq/cm ² 以上1 MBq/cm ² 以下のもの	1個につき	128,600	
			Cl-36大面積線源2 Bq/cm ² 以上 1 kBq/cm ² 以下のもの	1個につき	154,400	
		環境レベル放射能	体積線源の γ 線スペクトロメトリ20 Bq/g 以上100 kBq/g以下のもの	1個につき	106,200	
		γ 線核種放射能	密封線源又はアンプル線源 γ 線エネルギーが20 keV以上3 MeV以下で、 2 kBq 以上4 MBq以下のもの	1個につき	75,100	

24	中性子	中性子測定器校正試験	速中性子フルエンス エネルギー点：144 keV, 565 keV, 5.0 MeV, 14.8 MeV フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1個3試験点以下につき	286,200	4試験点以上6試験点以下は144,300円、7試験点以上9試験点以下は288,600円を加算する。
			速中性子フルエンス率 エネルギー点：144 keV, 565 keV, 5.0 MeV, 14.8 MeV フルエンス率範囲： 144 keV: 2.3 cm ⁻² s ⁻¹ 以上1.8×10 ³ cm ⁻² s ⁻¹ 以下 565 keV: 6.3 cm ⁻² s ⁻¹ 以上5.1×10 ³ cm ⁻² s ⁻¹ 以下 5.0 MeV: 2.5 cm ⁻² s ⁻¹ 以上2.0×10 ³ cm ⁻² s ⁻¹ 以下 14.8 MeV: 3.8 cm ⁻² s ⁻¹ 以上6.1×10 ³ cm ⁻² s ⁻¹ 以下	1個3試験点以下につき	286,200	4試験点以上6試験点以下は144,300円、7試験点以上9試験点以下は288,600円を加算する。
			速中性子フルエンス エネルギー点：2.5 MeV フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁷ cm ⁻² 以下	1個3試験点以下につき	284,000	4試験点以上6試験点以下は142,800円、7試験点以上9試験点以下は284,000円を加算する。
			速中性子フルエンス エネルギー点：8.0 MeV (3.5 MeV補正照射なし) フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1個1試験点につき	118,900	1試験点を追加する毎に55,600円を加算する。
			速中性子フルエンス エネルギー点：8.0 MeV (3.5 MeV補正照射あり) フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1個1試験点につき	196,600	1試験点を追加する毎に102,500円を加算する。
			速中性子フルエンス エネルギー点：1.2 MeV フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1個1試験点につき	263,800	1試験点を追加する毎に87,300円を加算する（最大5点まで）。6試験点目以降は基本手数料を適用する。
			速中性子フルエンス率 エネルギー点：1.2 MeV フルエンス率範囲：1.6 cm ⁻² s ⁻¹ 以上1.4×10 ³ cm ⁻² s ⁻¹ 以下	1個1試験点につき	263,800	1試験点を追加する毎に87,300円を加算する（最大5点まで）。6試験点目以降は基本手数料を適用する。
			速中性子フルエンス エネルギー点：250 keV フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1個1試験点につき	279,000	1試験点を追加する毎に151,000円を加算する。
			速中性子フルエンス率 エネルギー点：250 keV フルエンス率範囲：1.2 cm ⁻² s ⁻¹ 以上9.0×10 ² cm ⁻² s ⁻¹ 以下	1個1試験点につき	279,000	1試験点を追加する毎に151,000円を加算する。
			熱中性子フルエンス フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上 1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1個3試験点以下につき	327,400	4試験点以上6試験点以下は164,900円、7試験点以上9試験点以下は329,800円を加算する。
			熱中性子フルエンス率 フルエンス率範囲：5.0×10 ¹ cm ⁻² s ⁻¹ 以上 1.0×10 ⁴ cm ⁻² s ⁻¹ 以下	1個3試験点以下につき	327,400	4試験点以上6試験点以下は164,900円、7試験点以上9試験点以下は329,800円を加算する。
			中速中性子フルエンス エネルギー点：24 keV フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1個1試験点につき	165,700	1試験点を追加する毎に86,500円を加算する。
			中速中性子フルエンス率 エネルギー点：24 keV フルエンス率範囲：1.0×10 ⁻¹ cm ⁻² s ⁻¹ 以上1.6×10 ² cm ⁻² s ⁻¹ 以下	1個1試験点につき	165,700	1試験点を追加する毎に86,500円を加算する。
			連続スペクトル中性子フルエンス 線源種類： ²⁵² Cf, Am-Be フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1個3試験点以下につき	286,200	4試験点以上6試験点以下は144,300円、7試験点以上9試験点以下は288,600円を加算する。

		連続スペクトル中性子フルエンス率 線源種類： ²⁵² Cf, Am-Be フルエンス率範囲： Am-Be：4.1×10 ⁻¹ cm ⁻² s ⁻¹ 以上1.7×10 ² cm ⁻² s ⁻¹ 以下 ²⁵² Cf：2.0×10 ⁻¹ cm ⁻² s ⁻¹ 以上4.9×10 ² cm ⁻² s ⁻¹ 以下	1個3試験点以下につき	286,200	4試験点以上6試験点以下は144,300円、7試験点以上9試験点以下は288,600円を加算する。
		連続スペクトル中性子フルエンス (重水減速 ²⁵² Cf) フルエンス範囲：8.8×10 ² cm ⁻² 以上8.9×10 ⁷ cm ⁻² 以下	1個1試験点につき	166,400	1試験点を追加する毎に138,600円を加算する。
		連続スペクトル中性子フルエンス率 (重水減速 ²⁵² Cf) フルエンス率範囲：1.7×10 ¹ cm ⁻² s ⁻¹ 以上4.4×10 ² cm ⁻² s ⁻¹ 以下	1個1試験点につき	166,400	1試験点を追加する毎に138,600円を加算する。
		高エネルギー中性子フルエンス率（現地校正） エネルギー点：45 MeV フルエンス率範囲：5.0 cm ⁻² s ⁻¹ 以上2.5×10 ⁴ cm ⁻² s ⁻¹ 以下	1個1試験点につき	453,900	校正器物1個又は1試験点追加する毎に31,000円を加算する。
中性子測定器照射試験		速中性子フルエンス エネルギー点：144 keV, 565 keV, 5.0 MeV フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1照射につき	118,900	同じエネルギー点1照射を追加する毎に55,600円を加算する。
		速中性子フルエンス エネルギー点：2.5 MeV フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁷ cm ⁻² 以下 エネルギー点：14.8 MeV フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1照射につき	127,800	同じエネルギー点1照射を追加する毎に59,000円を加算する。
		速中性子フルエンス エネルギー点：8.0 MeV（3.5 MeV補正照射なし） フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1照射につき	118,900	同じエネルギー点1照射を追加する毎に55,600円を加算する。
		速中性子フルエンス エネルギー点：8.0 MeV（3.5 MeV補正照射あり） フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1照射につき	196,600	1照射を追加する毎に102,500円を加算する。
		速中性子フルエンス エネルギー点：1.2 MeV フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1照射につき	263,800	1照射を追加する毎に87,300円を加算する（最大5照射まで）。6照射目以降は基本手数料を適用する。
		速中性子フルエンス エネルギー点：250 keV フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1照射につき	279,000	1照射を追加する毎に151,000円を加算する。
		熱中性子フルエンス率 フルエンス率範囲：5.0×10 ¹ cm ⁻² s ⁻¹ 以上 1.0×10 ⁴ cm ⁻² s ⁻¹ 以下	1照射につき	101,400	1照射を追加する毎に94,200円を加算する。
		中速中性子フルエンス エネルギー点：24 keV フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1照射につき	165,700	1照射を追加する毎に86,500円を加算する。
		中速中性子フルエンス率 エネルギー点：24 keV フルエンス率範囲：1.0×10 ⁻¹ cm ⁻² s ⁻¹ 以上1.6×10 ² cm ⁻² s ⁻¹ 以下	1照射につき	165,700	1照射を追加する毎に86,500円を加算する。
		連続スペクトル中性子フルエンス 線源種類： ²⁵² Cf, Am-Be フルエンス範囲：1.0×10 ³ cm ⁻² 以上1.0×10 ⁸ cm ⁻² 以下	1照射につき	151,600	1照射を追加する毎に112,700円を加算する。
		連続スペクトル中性子フルエンス (重水減速 ²⁵² Cf) フルエンス範囲：8.8×10 ² cm ⁻² 以上8.9×10 ⁷ cm ⁻² 以下	1照射につき	159,000	1試験点を追加する毎に138,800円を加算する。
		高エネルギー中性子フルエンス率（現地校正） エネルギー点：45 MeV フルエンス率範囲：5.0 cm ⁻² s ⁻¹ 以上2.5×10 ⁴ cm ⁻² s ⁻¹ 以下	照射1時間につき	431,200	照射時間1時間追加する毎に8,300円を加算する。

		中性子個人線量計校正試験	中性子個人線量当量 線源種類： ²⁵² Cf, Am-Be 線量当量範囲：4.0×10 ⁻⁴ mSv以上4.0×10 ¹ mSv以下（ ²⁵² Cf） 4.1×10 ⁻⁴ mSv以上4.1×10 ¹ mSv以下（Am-Be）	1個1試験点につき	152,000	1試験点を追加する毎に137,600円を加算する。
			中性子個人線量当量率 線源種類： ²⁵² Cf, Am-Be 線量当量率範囲：2.9×10 ⁻⁵ mSv h ⁻¹ 以上7.1×10 ⁻¹ mSv h ⁻¹ 以下（ ²⁵² Cf） 6.0×10 ⁻⁴ mSv h ⁻¹ 以上2.5×10 ⁻¹ mSv h ⁻¹ 以下（Am-Be）	1個1試験点につき	152,000	1試験点を追加する毎に137,600円を加算する。
			中性子個人線量当量 （重水減速 ²⁵² Cf） 線量当量範囲：9.7×10 ⁻⁵ mSv以上9.8 mSv以下	1個1試験点につき	159,200	1試験点を追加する毎に138,600円を加算する。
			中性子個人線量当量率 （重水減速 ²⁵² Cf） 線量当量率範囲：7.0×10 ⁻³ mSv h ⁻¹ 以上1.8×10 ⁻¹ mSv h ⁻¹ 以下	1個1試験点につき	166,400	1試験点を追加する毎に138,600円を加算する。
		中性子サーベイメータ校正試験	中性子周辺線量当量 線源種類： ²⁵² Cf, Am-Be 線量当量範囲：3.9×10 ⁻⁴ mSv以上3.9×10 ¹ mSv以下	1個1試験点につき	152,000	1試験点を追加する毎に137,600円を加算する。
			中性子周辺線量当量率 線源種類： ²⁵² Cf, Am-Be 線量当量率範囲：2.8×10 ⁻⁵ mSv h ⁻¹ 以上6.8×10 ⁻¹ mSv h ⁻¹ 以下（ ²⁵² Cf） 5.7×10 ⁻⁴ mSv h ⁻¹ 以上2.4×10 ⁻¹ mSv h ⁻¹ 以下（Am-Be）	1個1試験点につき	152,000	1試験点を追加する毎に137,600円を加算する。
			中性子周辺線量当量 （重水減速 ²⁵² C f） 線量当量範囲：9.2×10 ⁻⁵ mSv以上9.3 mSv以下	1個1試験点につき	166,400	1試験点を追加する毎に138,600円を加算する。
			中性子周辺線量当量率 （重水減速 ²⁵² C f） 線量当量率範囲：6.6×10 ⁻³ mSv h ⁻¹ 以上1.7×10 ⁻¹ mSv h ⁻¹ 以下	1個1試験点につき	166,400	1試験点を追加する毎に138,600円を加算する。
		中性子源校正試験	中性子放出率 線源種類： ²⁵² Cf, Am-Be 中性子放出率範囲：1.0×10 ³ s ⁻¹ 以上3.0×10 ⁷ s ⁻¹ 以下（ ²⁵² Cf） 1.0×10 ³ s ⁻¹ 以上2.0×10 ⁷ s ⁻¹ 以下（Am-Be）	1個につき	120,400	
25	温度	極低温抵抗温度計	50 mK 以上 650 mK 以下(250 mKを超え400 mK 未満を除く)決められた24温度のみで校正をおこなう。	1本につき	1,447,600	校正器物を同時に5本まで校正する場合、1本追加につき30,400円を加算する。 【同時に6本以上8本以下で校正する場合】 295,400円を加算する他、6本を超える本数1本につき31,100円を加算する。 【同時に9本以上12本以下で校正する場合】 421,700円を加算する他、9本を超える本数1本につき30,400円を加算する。
26	湿度	露点計	露点範囲：+85℃以上 +95℃以下	1個1点につき	200,300	1測定点を追加する毎に59,100円を加算する。（追加は最大2測点まで）
			露点範囲：-70℃以上-10℃以下	1個1点につき	317,400	測定点1点を追加する毎に63,500円を加算する。（追加は最大6測点まで）

		物質量分率表示が可能な微量水分計	ガス種:窒素 12 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/mol の6 校正点	1 個6校正点 までにつき	990,800	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
			ガス種:窒素 12 nmol/mol 以上 1 200 nmol/mol 以下	1個1点につき	584,900	校正点の値の±5 %以内、又は±1 nmol/mol以内の差は許容とする。 1校正点を追加する毎に299,400円を加算する。
			ガス種:窒素 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 500 nmol/mol, 1 000 nmol/mol, 3 000 nmol/mol, 5 000 nmol/mol の8 校正点	1 個8校正点 までにつき	1,011,800	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
			ガス種:アルゴン 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/mol の6 校正点	1 個6校正点 までにつき	957,100	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol 以内の差は許容とする。
			ガス種: ヘリウム 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/molの6校正点	1個6校正点ま でにつき	1,145,900	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
			ガス種: 酸素 10 nmol/mol, 20 nmol/mol, 50 nmol/mol, 100 nmol/mol, 510 nmol/mol, 1 000 nmol/molの6校正点	1個6校正点ま でにつき	1,294,300	各校正点の値の±10 %以内、又は±2 nmol/mol以内の差は許容とする。
		物質量分率表示が可能な微量水分計の応答試験	12 nmol/mol 以上 1 200 nmol/mol 以下	1個、測定14 日間につき	773,400	1日追加する毎に67,600円を加算する。
27	熱物性	熱膨張率（線膨張係数）	試験対象物質：JIS B7506 で定めるブロックゲージと同等な形状精度をもつ固体試験片 呼び寸法の範囲：20 mm以上100 mm以下 測定温度範囲：5 ℃以上35 ℃以下	1校正点につ き	53,100	1校正点を追加する毎に24,000円を加算する。
		熱拡散率	4枚組（室温）	1件につき	154,900	
			4枚組(500 K+700 K+ 900 K+1 200 K)	1件につき	433,600	
			1枚組（室温）	1件につき	50,600	
			1枚組（高温 500 K以上1 200 K以下1点）	1件1点につき	70,300	1測定点を追加する毎に39,000円を加算する。
			1枚組（高温1 200 Kを超え1 500 K以下1点）	1件1点につき	78,900	1測定点を追加する毎に39,000円を加算する。
		比熱容量測定	1枚（300 K以上900 K以下の任意の温度1点）	1枚1点につき	84,400	1点を追加する毎に45,700円を加算する。 校正装置：示差走査熱量測定装置
			1枚（900 K以上1 600 K以下の任意の温度1点）	1枚1点につき	85,900	1点を追加する毎に46,200円を加算する。 校正装置：示差走査熱量測定装置
			1枚（50 K以上350 K以下の任意の温度1点）	1枚1点につき	177,400	1点を追加する毎に65,800円を加算する。 校正装置：冷凍機式断熱型熱量計
			1枚（300 K以上473.15 K以下の任意の温度1点）	1枚1点につき	113,600	1点を追加する毎に55,800円を加算する。 校正装置：断熱型熱量計
		熱流密度	校正対象：熱流センサ （1辺9 mm 以上50 mm 以下の平板状）	1個2点につき	182,900	2点をを超え1点増す毎に、65,600円を加算する。

28	硬さ	ロックウェル硬さ標準片	Bスケール 30 HRBW 以上100 HRBW 以下	3個まで	138,000	
30	粒子・粉体 特性	粒径	粒径標準粒子 粒径 10 nm以上300 nm以下	1試料につき	480,600	ポリスチレン粒子やシリカ粒子など（要事前相談）
			粒径標準粒子 粒径 100 nm以上1 μm以下	1試料につき	605,100	
			粒径標準粒子 粒径分布幅 0.3 nm以上10 nm以下	1試料につき	480,600	粒径10 nm以上300 nm以下のポリスチレン粒子やシリカ粒子など（要事前相談）
			粒径標準粒子 粒径10 nm以上300 nm以下及び粒径分布幅 0.3 nm以上10 nm以下	1試料につき	595,900	ポリスチレン粒子やシリカ粒子など（要事前相談）
			微分型電気移動度分析器 中心電気移動度に対応する粒径 10 nm, 15 nm, 23 nm, 41 nm, 55 nm	1台（1粒径を含む）につき	496,300	1粒径を追加する毎に142,100円を加算する。
		粒子質量	粒子質量500 ag以上500 fg以下	1試料につき	531,000	
		液中粒子数濃度	粒径 2 μm以上20 μm以下 濃度 5×10^3 個/g以上 2×10^6 個/g以下	1試料につき	650,500	希釈有
			粒径 2 μm以上20 μm以下 濃度 5×10^2 個/g 以上 5×10^3 個/g 未満	1試料につき	644,500	希釈無
			粒径 600 nm以上 2 μm 未満 濃度 5×10^2 個/g 以上 1×10^3 個/g 未満	1試料につき	700,900	希釈無
			粒径 600 nm 以上 2 μm 未満 濃度 1×10^3 個/g 以上 2×10^6 個/g 以下	1試料につき	706,900	希釈有
		気中粒子数濃度	凝縮粒子計数器の検出効率 濃度 1×10^3 cm ⁻³ 以上 4×10^3 cm ⁻³ 以下（粒径 10 nm以上300 nm以下） 濃度 4×10^3 cm ⁻³ 以上 1×10^4 cm ⁻³ 以下（粒径 10 nm以上200 nm以下） 濃度 1×10^0 cm ⁻³ 以上 1×10^5 cm ⁻³ 以下（粒径 30 nm以上100 nm以下）	1台（5校正点を含む。）につき	569,500	1校正点を追加する毎に93,700円を加算する。
		気中粒子電荷量濃度	ファラデーカップ式エアロゾル電流計の検出効率 濃度 0.16 fC cm ⁻³ 以上 0.64 fC cm ⁻³ 以下（粒径 10 nm以上300 nm以下） 濃度 0.64 fC cm ⁻³ 以上 1.6 fC cm ⁻³ 以下（粒径 10 nm以上200 nm以下） 濃度 1.6 fC cm ⁻³ 以上 16 fC cm ⁻³ 以下（粒径 30 nm以上60 nm以下）	1台（5校正点を含む。）につき	569,500	1校正点を追加する毎に93,700円を加算する。 粒子の電荷数を+1と仮定して粒子電荷量濃度を粒子数濃度に換算・表示する機器を含む。この場合、左記の粒子電荷量濃度に対応する粒子数濃度は以下の通り。 濃度 1×10^3 cm ⁻³ 以上 4×10^3 cm ⁻³ 以下（粒径 10 nm以上300 nm以下） 濃度 4×10^3 cm ⁻³ 以上 1×10^4 cm ⁻³ 以下（粒径 10 nm以上200 nm以下） 濃度 1×10^4 cm ⁻³ 以上 1×10^5 cm ⁻³ 以下（粒径 30 nm以上60 nm以下）
		気中粒子数	光散乱式気中粒子計数器の検出効率（粒子数基準及び粒子数濃度基準） 粒子計数頻度： 10 s^{-1} ～ 100 s^{-1} 粒径範囲：0.5 μm ～10 μm	1台につき（2粒径、1粒子計数頻度）	281,400	3粒径以上の場合には、1粒径につき29,700円を加算する。同一粒径において粒子計数頻度を追加する場合には、12,400円を加算する。粒径は以下の①又は②のシリーズから選択し、このシリーズの中から粒径を選択する。① 10 μm, 6 μm, 3 μm, 2 μm, 1 μm, 0.7 μm, 0.5 μm② 5 μm, 2 μm, 1 μm, 0.5 μm定格流量範囲：0.3 L/min ～ 30 L/min(参考) 粒子数濃度流量 30 L/min の場合、 0.02 cm^{-3} ～ 0.2 cm^{-3} 流量0.3 L/min の場合、 2 cm^{-3} ～ 20 cm^{-3}

31	純度	高純度有機標準物質	核磁気共鳴法及び凝固点降下法による純度測定（純度範囲 98 %以上100 %以下）	1試料につき	182,300	
			核磁気共鳴法による純度測定（純度範囲 90 %以上100 %以下） ガスクロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	122,400	
			核磁気共鳴法による純度測定（純度範囲 90 %以上100 %以下） 高速液体クロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	115,900	
			凝固点降下法による純度測定（純度範囲 98 %以上100 %以下） ガスクロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	132,600	
			凝固点降下法による純度測定（純度範囲 98 %以上100 %以下） 高速液体クロマトグラフ法による純度の妥当性確認を含む	1試料につき	128,200	
			核磁気共鳴法及び滴定法による純度測定（純度範囲 60 %以上100 %以下）	1試料につき	279,900	分析対象成分以外の有機化合物の総量が10 %を超えないこと
32	薄膜・多層膜	膜厚	X線反射率法による薄膜・多層膜構造の膜厚校正（各層1 nm以上200 nm以下、総膜厚3 nm以上200 nm以下）	1個につき	294,100	1校正点を追加する毎に243,600円を加算する。
33	濃度	標準ガス	ホルムアルデヒドの濃度測定（1 μ mol/mol 以上 8 μ mol/mol 以下）	1試料につき	385,000	
			メタン濃度（1 600 nmol/mol以上2 600 nmol/mol以下）	1試料につき	141,400	空気組成（窒素、酸素、アルゴン）であって、メタンガス濃度範囲が1 600 nmol/molから2 600 nmol/molであり、高圧容器詰め混合ガスとして3 MPa以上であること
34	分子量	高分子標準物質	静的光散乱法による質量平均モル質量 プルラン[CAS No. 9057-02-7] 2×10 ⁵ g mol ⁻¹ 以上 8×10 ⁵ g mol ⁻¹ 以下	1試料につき	325,000	乾燥粉末状態のもの
51	計量器の構成要素及び検査装置の試験	はかりの制温装置(試験温度-10 ℃～60 ℃)		1個につき	62,000	
		はかり・制温ばね等の温度による試験		1件につき	95,400	
		質量計用ターミナル・デジタルディスプレイ	NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料	1件につき	57,600	
			JIS B 7611-2（環境試験レベルH）		458,700	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。 試験器物を1台追加する毎に228,400円を加算する。
			JIS B 7611-2（環境試験レベルL）		256,100	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。試験器物を1台追加する毎に126,700円を加算する。
			型式の追加及び変更（個別項目）		147,900	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。 試験器物を1台追加する毎に72,600円を加算する。 1試験項目を追加する毎に44,000円を加算する。
			型式の変更及び追加（試験なし）		57,600	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。

	質量計用指示計（アナログ信号）		NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料	1件につき	57,600	
			JIS B 7611-2（環境試験レベルH）		1,016,700	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。 ただし、型式承認試験による環境試験データの活用が出来る場合には、304,900円を減算した額を基本料金とする。 試験器物を1台追加する毎に507,600円を加算する。
			JIS B 7611-2（環境試験レベルL）		786,000	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。 ただし、型式承認試験による環境試験データの活用が出来る場合には、235,700円を減算した額を基本料金とする。 試験器物を1台追加する毎に392,300円を加算する。
			型式の追加及び変更（個別項目）		252,600	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。 試験器物を1台追加する毎に125,600円を加算する。 1試験項目を追加する毎に75,800円を加算する。
			型式の変更及び追加（試験なし）		57,600	基本料金には、基本性能の確認及び機能確認の手数料が含まれる。
	質量計用ロードセル （OIML R60に対応する型式）		NMIJ若しくはNMIJと相互承認を結んだ発行機関が発行したOIML適合証明書、又はNMIJが発行した試験報告書により審査し、新たな試験の実施を省略する場合の審査料	1件につき	57,600	
	アナログロードセル	最大容量 100 kg以上 1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	500,800	器物を1台追加する毎に284,300円を加算する。 （一部試験については除外）
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	517,600	器物を1台追加する毎に285,600円を加算する。 （一部試験については除外）
			型式の追加試験（計量性能試験）	1台につき	285,600	
			型式の追加試験（計量性能＋湿度試験）	1台につき	493,000	
		最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	662,900	器物を1台追加する毎に434,200円を加算する。 （一部試験については除外）
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	683,500	器物を1台追加する毎に436,700円を加算する。 （一部試験については除外）
			型式の追加試験（計量性能試験）	1台につき	436,700	
			型式の追加試験（計量性能＋湿度試験）	1台につき	652,700	

		デジタルロードセル	最大容量 100 kg以上 1 000 k g以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	1, 006, 300	器物を1台追加する毎に284, 300円を加算する。 （一部試験については除外）
				精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	1, 023, 200	器物を1台追加する毎に285, 600円を加算する。 （一部試験については除外）
				型式の追加試験（計量性能試験）	1台につき	285, 600	
				型式の追加試験（計量性能＋湿度試験）	1台につき	493, 000	
				型式の追加試験（影響試験）	1台につき	148, 800	
				型式の追加試験（妨害試験）	1台につき	416, 800	
		最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	1, 168, 500	器物を1台追加する毎に434, 200円を加算する。 （一部試験については除外）	
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	1, 189, 100	器物を1台追加する毎に437, 200円を加算する。 （一部試験については除外）	
			型式の追加試験（計量性能試験）	1台につき	436, 700		
			型式の追加試験（計量性能＋湿度試験）	1台につき	652, 700		
			型式の追加試験（影響試験）	1台につき	230, 800		
			型式の追加試験（妨害試験）	1台につき	416, 800		
	ガスメーターの構成要素	計測部 基本性能試験（JIS B8571：2022 12. 6. 1～12. 6. 11（12. 6. 9 を除く））			1型式につき	316, 100	
		計測部 器差試験（JIS B8571：2022 12. 6. 1）			1型式につき	184, 500	
		計測部 耐久試験（JIS B8571：2022 12. 6. 9）			1型式につき	220, 800	
		計測部 振動試験（JIS B8571：2022 12. 6. 13）			1型式につき	214, 700	
		電子装置（JIS B8571：2022 12. 6. 15）			1型式につき	465, 300	
水道・温水メーターの構成要素	計測部 器差試験（JIS B8570-2:2013 7. 5）			1型式につき	78, 200		
	計測部 基本性能試験（JIS B8570-2:2013 7. 4～7. 9）			1型式につき	115, 300		
	計測部 促進耐久試験（JIS B8570-2:2013 7. 10）			1型式につき	223, 700		
	電子装置 電子化試験（JIS B8570-2:2013 7. 11）			1型式につき	288, 500		

		積算熱量計の構成要素	体積計量部 器差試験（JIS B7550:2017 9.5.4.2）		1型式につき	79,600	
			体積計量部 基本性能試験（JIS B7550:2017 9.5.4.2, 9.5.15, 9.5.16）		1型式につき	95,100	
			体積計量部 耐久試験（JIS B7550:2017 9.5.8.1）		1型式につき	456,400	
			感温部 器差試験（JIS B7550:2017 9.5.4.4）		1型式につき	28,800	
			感温部 耐久試験（JIS B7550:2017 9.5.8.2）		1型式につき	28,800	
			演算部 器差試験（JIS B7550：2017 9.5.4.3）		1型式につき	21,600	
			演算部・体積計量部 電子化試験（JIS B7550:2017 9.5.5～9.5.14（9.5.8を除く））		1型式につき	303,100	
		燃料油メーター用空気分離器			1個につき	104,200	
		燃料油メーター用ホース			1個につき	12,000	
		燃料油メーター用表示装置			1件につき	413,400	
		特定計量器外部接続装置の性能試験	タクシーメーター		1件につき	282,100	
			燃料油メーター用販売時点情報管理装置		1件につき	413,400	
		計量性能確認試験	最大容量100 kg以上 1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD	1台につき	285,600	
			最大容量2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD	1台につき	436,700	
		試験装置の認定試験	初回試験		1件につき	39,600	
			次回以降試験		1件につき	10,800	
52	その他	体積管	200 L以下			54,400	試験液が油の場合は、27,100円を加算する。
			200 Lを超えるもの			160,600	試験液が油の場合は、80,300円を加算する。
		流量	石油用	口径80 mm以下	1個1流量につき	14,700	
				口径80 mmを超えるもの	1個1流量につき	20,800	

53

O I M L 適合性試験

既存のOIML適合証明書、OIML-MAA適合証明書、OIML-CS適合証明書又はNMIJが発行した試験報告書のみで審査する場合（新たな試験の実施を完全に省略する場合）の審査料 1件につき 57,600円
下記の手数料（基本料金）には審査料が含まれています。

非自動はかり	1992年版の技術基準に基づく証明書		1件につき	979,700	計量法に基づき型式承認試験等によって得られた試験成績書を用いる事により、新たな試験の実施を省略する場合がある。その際、669,900円（税別）を限度として、これを基本料金から減算する。		
	2006年版の技術基準に基づく証明書 完成はかり 試験対象：ひょう量 300 kgまで		1件につき	1,215,800	計量法に基づき型式承認試験等によって得られた試験成績書を用いる事により、新たな試験の実施を省略する場合がある。その際、680,500円（税別）を限度として、これを基本料金から減算する。		
質量計用ロードセル	2000年版又は2017年版の技術基準に基づく証明書 アナログロードセル	タイプ：ビーム式 出力信号：アナログ信号 ひょう量：200 kg及び1 000 kg 湿度記号：NH 精度等級：C3（目量の数 3 000以下）及びD		1件につき	502,400		
		最大容量 100 kg以上 1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH		1件につき	551,200	器物を1台追加する毎に334,800円を加算する。 （一部試験については除外）
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH		1件につき	568,100	器物を1台追加する毎に336,000円を加算する。 （一部試験については除外）
			型式の追加試験（計量性能試験）		1台につき	336,000	
			型式の追加試験（計量性能＋湿度試験）		1台につき	543,500	
		最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH		1件につき	713,400	器物を1台追加する毎に484,700円を加算する。 （一部試験については除外）
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH		1件につき	734,000	器物を1台追加する毎に487,100円を加算する。 （一部試験については除外）
			型式の追加試験（計量性能試験）		1台につき	487,200	
			型式の追加試験（計量性能＋湿度試験）		1台につき	703,200	
	2000年版の技術基準に基づく証明書 デジタルロードセル	最大容量 100 kg以上 1 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH		1件につき	1,056,800	器物を1台追加する毎に334,800円を加算する。 （一部試験については除外）
			精度等級C6以下及びD、湿度記号SH		1件につき	1,073,700	器物を1台追加する毎に336,000円を加算する。 （一部試験については除外）
			型式の追加試験（計量性能試験）		1台につき	336,000	
			型式の追加試験（計量性能＋湿度試験）		1台につき	543,500	
			型式の追加試験（影響試験）		1台につき	199,300	
			型式の追加試験（妨害試験）		1台につき	467,200	

			最大容量 2 500 kg以上 20 000 kg以下	精度等級C6以下及びD、湿度記号CH	1件につき	1, 218, 900	器物を1台追加する毎に484, 700円を加算する。 (一部試験については除外)
				精度等級C6以下及びD、湿度記号SH	1件につき	1, 239, 600	器物を1台追加する毎に487, 100円を加算する。 (一部試験については除外)
				型式の追加試験（計量性能試験）	1台につき	487, 200	
				型式の追加試験（計量性能＋湿度試験）	1台につき	703, 200	
				型式の追加試験（影響試験）	1台につき	281, 200	
				型式の追加試験（妨害試験）	1台につき	467, 200	
		自動車等給油メーター	1995年版の技術基準に基づく証明書		1件につき	2, 169, 300	現地試験を実施する場合がある。その際、832, 900円を限度として、これを基本料金から減算する。
			2007年版の技術基準に基づく証明書		1件につき	2, 560, 200	現地試験を実施する場合がある。その際、894, 200円を限度として、これを基本料金から減算する。
			2019年版の技術基準に基づく証明書		1件につき	2, 560, 200	現地試験を実施する場合がある。その際、894, 200円を限度として、これを基本料金から減算する。
		発行済みのOIML適合証明書、OIML-MAA適合証明書又はOIML-CS適合証明書の申請者名、申請者住所等の変更に伴う審査料					1件につき